

平成21年度シンクロトン光利用者研究会

主催：愛知県・（財）科学技術交流財団
大学連合（名古屋大・名古屋工大・豊橋技科大・豊田工大）

本年度の利用者研究会は、手法で4つの小グループに分け、各グループでの勉強会方式にて開催いたします。各グループ、30名程度のメンバーを募集し（複数参加可能）、本年度中に各3回の研究会を催します。具体的には、以下のような内容を予定しています。

グループ名	手法・対象・内容
硬X線XAFS 軟X線XAFS 蛍光X線分析 通称: XAFSグループ	・ XAFS；元素（Na～U）の化学状態 （例）電池・触媒などの酸化・還元反応 ・ 局所構造（原子間距離・配位数） （例）鉄鋼・非鉄金属・半導体・セラミックスのなどの材料開発 ・ 蛍光X線分析； 蛍光X微量分析 （例）品質管理・食品の安全性検査 第2回研究会 日時：2009年10月28日（水）13:30～ 場所：名古屋大学 VBL3階
真空紫外線分光 通称: 真空紫外グループ	・ 元素（K端Li～Ne, L～N端 Uまで）の化学状態 （例）電池・触媒の酸化・還元反応 ・ 局所（表面・界面）構造 （例）電池・生体分子等の材料分析 ・ 材料の電子状態（伝導・磁気状態）（例）磁性材料の分析 ・ 実験室系の光電子分光装置では十分なデータ収集ができない方 第2回研究会 日時：2009年11月5日（木）14:00～ 場所：名古屋大学 インキュベーション施設
小角散乱 薄膜・反射率測定 通称: 小角散乱グループ	・ 実験室の小角散乱装置で十分でない方、測定時間が非常にかかる方 ・ 数Åから数百nmまでの構造解析、非晶構造、結晶構造、相分離構造、球晶構造、配向、延伸、破壊やこれらの階層構造分散粒子のサイズやそのサイズ分布の測定（同時測定を含む） ・ 光散乱や熱分析などとの同時測定 ・ 薄膜中の多層構造や配向構造の測定 ・ 解析手法のイロハ 第2回研究会 日時：2009年11月6日（金）13:30～ 場所：愛知県産業労働センター
X線粉末回折測定 薄膜・反射率測定 通称: 粉末回折グループ	・ 有機材料の分子構造 ・ 無機材料の同定、構造解析 ・ 実験室系の粉末回折装置では、十分なデータが収集できない方 第2回研究会 日時：2009年11月4日（水）14:00～ 場所：愛知県産業労働センター

（詳細は2ページ目をご覧ください）

粉末回折グループ利用者研究会（プログラム）詳細

第2回

日時：2009年11月4日（金）14:00～（受付13:30より）

場所：愛知県産業労働センター ウィンクあいち 1209会議室

プログラム：

14:00～14:05 開会

14:05～15:00 「放射光を利用した粉末回折測定および事例紹介」

A G Cセイミケミカル F C事業推進本部 伊藤孝憲

15:10～16:05 「SPRING-8/BL19B2における放射光粉末回折と産業利用」

高輝度光科学研究センター 大坂恵一

16:05～16:15 事務局より

16:20～ 個別相談

UVSOR見学

2009年12月上旬（別途案内）

第3回

日時：2010年1月頃予定

場所：未定

プログラム：未定

第1回 終了

日時：2009年7月27日

場所：名古屋大学

プログラム

「粉末X線回折でわかることー利用の基礎から解析までー」名古屋大学 澤 博

「粉末回折データを用いた未知構造解析」 リガク 佐々木明登

■申込み方法

ホームページからの申込みはこちらから

<http://www.nusrc.nagoya-u.ac.jp/kenkyukai2009/index.html>

メール・ファックスからの申込みは必要事項をご記入の上、以下のアドレス又は番号にお送りください。

toshiaki_nakao@pref.aichi.lg.jp FAX 052-954-6977へお送り下さい

必要事項： 参加希望のグループ名 小角散乱

会社名・所属・役職

氏名

住所

メールアドレス

電話・ファックス

■場所

愛知県産業労働センター（ウィンクあいち） 1205会議室

名古屋市中村区名駅4丁目4-38

052-571-6131

JR・地下鉄・名鉄・近鉄 名古屋駅より徒歩2分

